

結晶性の有無

1. 目的

結晶性有無の確認

2. 試料名および試料数

もみ殻シリカ粉末

(1 検体)

3. 分析試験方法

3.1 分析項目

X線回折法による化合物組成解析

3.2 使用装置

X線回折分析装置 SmartLab (Rigaku 製)

3.3 分析条件

試料を有姿のまま、測定セル (Al 製) に充填した。

X線管球	: Cu K α	光学系	: 集中法
管電圧・管電流	: 45kV 200mA	スキャン範囲	: 5 - 80 deg
スキャンステップ	: 0.02 deg	スキャンスピード	: 10 deg / min
検出器	: 一次元半導体検出器		

4. 分析結果

測定チャートをページ 1~3 に示した。

測定の結果、試料から非晶質に由来するピークが検出された。対して、結晶性化合物に由来するピークは検出されなかった。

5. 添付資料

X線回折チャート

(生データ、定性分析結果、ピークリスト)

3 枚

以上